

L負荷試験装置 一覧表

型番	品名	対応デバイス	チャンネル数	VDS電源 Max. [V]	VG電源		IDP検出		チェック機能		ソフト L負荷	ハンドラ I/F	備 考
					VGON Max. [V]	VGOFF Max. [V]	検出電流 Max. [A]	検出時間 Max. [us]	コンタクト	デバイス			
EF-910B	Po.MOS FET L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1	R1,R2 ±200	±29.9	±29.9	R1,R2 99.9	999	○	○	×	○	トータル、分類カウンター 本体、電源、HEAD、CONT.
EF-910C	Po.MOS FET L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1	R1,R2 ±200	±29.9	±29.9	R1,R2 99.9	999	○	○	×	○	L負荷回数設定 Max. 20 トータル、分類カウンター 本体、電源、HEAD、CONT.
EF-9205	L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1	±99.9	±19.9	±19.9	±49.9	999	○	○	×	○	本体、HEAD
EF-9301	L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1	±99.9	±19.9	±19.9	±59.9	99,999	○	○	×	○	本体、HEAD
EF-9301A	L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1	±99.9	±19.9	±19.9	±79.9	9,999	○	○	×	○	本体、HEAD
EF-9301B	L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	2	±99.9	±19.9	±19.9	±59.9	99,999	○	○	×	○	本体、HEAD
EF-9301C	L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1	±99.9	±19.9	±19.9	±79.9	9,999	○	○	Max. 990ms	○	本体、HEAD
EF-9301F	L負荷テスタ	Nch MOS FET	1	+99.9	+19.9	-19.9	+79.9	9,999	○	○	1000~ 99,000	○	本体、HEAD
EF-9309	L負荷テスタ	Nch/Pch Tr & FET	1	R1,R2 ±300	±29.9	±29.9	±39.9	R1,R2,R3 100,000	○	○	×	○	クランプ電源 Max. ±999V 他 本体、電源、HEAD
EF-9310	連続L負荷 寿命試験装置	Nch/Pch MOS FET	10	±150	±19.9	±19.9	±60	R1~R4 99,900	×	×	×	×	印可周期 : Max.999ms 試験時間 : Max.999時間59分 COT, MES, MAIN PS,HEAD
EF-9501	Po.MOS FET L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1	±200.0	±30.0	±30.0	±40.0	R1~R4 200,000	○	○	×	○	他 BVDS、TW 測定 3段ラック、HEAD、コンソール
EF-9503	L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	2	±99.9	±19.9	±19.9	±59.9	R1,R2 99,990	○	○	×	○	本体、HEAD
EF-9503A	L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	2	±149	±19.9	±19.9	R1,R2 120	R1,R2 99,990	○	○	×	○	本体、HEAD

L負荷試験装置 一覧表

型番	品名	対応デバイス	チャンネル数	VDS電源 Max. [V]	VG電源		IDP検出		チェック機能		ソフト L負荷	ハンドラ I/F	備 考
					VGON Max. [V]	VGOFF Max. [V]	検出電流 Max. [A]	検出時間 Max. [us]	コンタクト	デバイス			
EF-9504	L負荷テスタ	8pin SOP MOS FET	1	±49.9	±29.9	±29.9	R1,R2 39.9	1,000	○	○	×	○	トータル、分類カウンター 本体、HEAD
EF-9504A	L負荷テスタ	8pin SOP MOS FET	1	±49.9	±29.9	±29.9	R1,R2 39.9	1,000	○	○	×	○	トータル、分類カウンター、I/Fが異なる 本体、HEAD
EF-9504B	L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1-HEAD 2素子	±59.9	±29.9	±29.9	R1,R2 39.9	9,999	○	○	×	○	トータル、分類カウンター 本体、電源、HEAD
EF-9504C	L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1-HEAD 2素子	±59.9	±29.9	±29.9	R1,R2 39.9	9,999	○	○	×	○	トータル、分類カウンター、高機能MOS 本体、電源、HEAD
EF-9605	L負荷テスタ	8pin TSSOP MOS FET	1-HEAD 2素子	±59.9	±19.9	±19.9	±9.99	25,000	○	○	×	○	他 絶縁&リークテスト、カウンター付 本体、電源、HEAD
EF-5001	L負荷テスタ	N-ch MOS FET	1	+39.9	+5V固定		+199	999	○	○	×	○	前後にIDSS試験 本体、HEAD
EF-5002	Po.MOS FET L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	2	+99.9	±19.9	±19.9	±59.9	R1,R2 9,999	×	○	1000~ 99,000	○	本体、HEAD×2
EF-5004	L負荷テスタ	8pin SOP MOS FET	1-HEAD 2素子	R1,R2 ±199	±29.9	±29.9	R1,R2 59.9	5,000	○	○	×	○	レポート機能付、トータル、分類カウンター 本体、電源、HEAD
EF-5005	Po.MOS FET L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1	+99.9	±29.9	±29.9	R1,R2 9.99	999	○	○	×	○	RS-232C 本体、HEAD
EF-911A	連続L負荷 寿命試験装置	Nch/Pch MOS FET	10	±150	±19.9	±19.9	R1,R2 99.9	R1~R4 99,900	×	×	×	×	印可周期 : Max.9.99s 試験時間 : Max.999時間59分 COT, MES, MAIN PS,HEAD
EF-5203	L負荷テスタ	8pin SOP MOS FET	1-HEAD 2素子	R1,R2 ±199	±29.9	±29.9	R1,R2 59.9	5,000	○	○	×	○	トータル、分類カウンター 本体、電源、HEAD
EF-5502	L負荷テスタ	Nch MOS FET	1	+119.9	+29.9	-29.9	R1,R2 59.9	R1,R2 9,990	×	×	×	○	本体、電源、HEAD、DUT
EF-9906	Po.MOS FET L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1	±49.9	±29.9	±29.9	R1,R2 9.99	999	○	○	×	○	本体、HEAD
EF-5101	L負荷テスタ	Nch/Pch MOS FET	1	±149	±19.9	±19.9	R1~R3 199	9,999	○	○	×	○	プロハ 19S 本体、電源、HEAD

